



ФАНО РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2.06/15-16

Очная, заочная форма обучения

(подчеркнуть)

2015/2016 учебного года

Форма контроля – зачет, экзамен (подчеркнуть)

Дисциплина Методы радиационных исследований изделий электронной техники

Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника

(направленность: 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления)

Курс: 1 группа: 1 Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану 108 ч.

Ф.И.О. преподавателей: к.т.н., доцент, заместитель директора ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по наноэлектронике М.С. Горбунов

Дата проведения зачета, экзамена 15 июня 2016 г.

№ п/п	Ф.И.О. аспирантов	№ зачетной книжки	Отметка о сдаче зачета	Экзаменационная оценка		Подпись экзаменатора
				цифрой	прописью	
1	2	3	4	6	7	8
1	Максимов Александр Сергеевич	15-2	<i>не сдача</i>	—		<i>А.А.</i>
2	Соловьева Людмила Александровна	15-3	<i>зачет</i>			<i>А.А.</i>
3	Токарев Игорь Владимирович	15-4	<i>зачет</i>			<i>А.А.</i>
4			<i>7</i>			
5						
6						

Число аспирантов на экзамене (зачете) 2

Из них получивших «отлично» —

получивших «хорошо» —

получивших «удовлетворительно» —

получивших «неудовлетворительно» —

Число аспирантов, не явившихся на экзамен (зачет) 1

Число аспирантов, не допущенных к экзамену (зачету) —

Зав. аспирантурой *Д.А.А.*

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Принимать экзамены от аспирантов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость.
2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев, специально разрешенных директором.

